



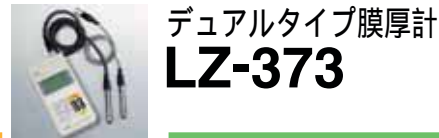
電磁膜厚計
LE-373

LE-373は磁性体上のメッキ(電解ニッケルメッキは除く)塗装などの被膜厚を測定する膜厚計です。プリンタやコンピュータにデータを転送することができ、アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能、測定データメモリ、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など16種の機能を装備しています。



渦電流膜厚計
LH-373

LH-373は非磁性金属上の絶縁被膜厚を測定する膜厚計です。アルマイトなどの比較的薄い被膜厚を精度良く測定することができます。付加機能はLE-373と同様でプリンタやコンピュータへのデータ転送、測定回数、平均値、最大最小値、標準偏差などの簡単な統計処理が可能です。



デュアルタイプ膜厚計
LZ-373

LZ-373は磁性体および非磁性金属上の被膜厚の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。プリンタやコンピュータへのデータ転送、測定回数、平均値、最大最小値、標準偏差などの簡単な統計処理や、16種類もの付加機能を装備しています。

仕様	LE-373	LH-373	LZ-373
測定方式	電磁誘導式	渦電流式	電磁誘導式 / 渦電流式兼用
測定対象	磁性金属上の非磁性被膜	非磁性金属上の絶縁被膜	磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲	0 ~ 2500 μmまたは99.0mils	0 ~ 1200 μmまたは47.0mils	電磁誘導式: 0 ~ 2500 μmまたは99.0mils 渦電流式: 0 ~ 1200 μmまたは47.0mils
測定精度	50 μm未満: ±1 μm, 50 μm以上1000 μm未満: ±2% 1000 μm以上: ±3%		
分解能	100 μm未満: 0.1 μm, 100 μm以上: 1 μm		
データメモリ	39,000点		
検量線メモリ	アプリケーションメモリ: 100本の検量線を記憶		
付加機能	アプリケーションメモリ: 電磁誘導式50本, 渦電流式50本		
適合規格	JIS K5600-1-7, JIS H8501, JIS H0401 ISO 2808, ISO 2064, ISO 1460, ISO 2178, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499, ASTM D 7091-5, ASTM E 376	JIS K5600-1-7, JIS H8680-2, JIS H8501 ISO 2808, ISO 2360, ISO 2064, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5, ASTM E 376	電磁誘導式: JIS K5600-1-7, JIS H8501, JIS H0401 ISO 2808, ISO 2064, ISO 1460, ISO 2178, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499, ASTM D 7091-5, ASTM E 376 渦電流式: JIS K5600-1-7, JIS H8680-2, JIS H8501 ISO 2808, ISO 2360, ISO 2064, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5, ASTM E 376
プローブ	一点接触定圧式 (LEP-J)	一点接触定圧式 (LHP-J)	一点接触定圧式 (LEP-J, LHP-J)
表示方法	デジタル(バックライト付) LCD 128 x 64 dots, 表示最小桁 0.1 μm)		
外部出力	パソコン(USBまたはRS-232C), プリンタ(RS-232C)に出力可能		
電源	1.5V(単3アルカリ) x 4		
消費電力	80mW(バックライト非点灯時)		
電池寿命	100時間(バックライト非点灯時、連続使用)		
使用温度範囲	0 ~ 40		
寸法・質量	75(W) x 145(D) x 31(H)mm, 0.34Kg		
共通付属品	標準板セット、標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース、電池1.5V(単3アルカリ) x 4		
専用付属品	鉄素地 (FE-370)	アルミ素地 (NFE-370)	鉄素地 (FE-370), アルミ素地 (NFE-370)
オプション	標準板(付属品以外の厚さ)、測定スタンド LW-990、プリンタ VZ-380、プリンタケーブル、パソコンケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト:「データロガー LDL-03」、データ管理ソフト:「McWAVEシリーズ」		

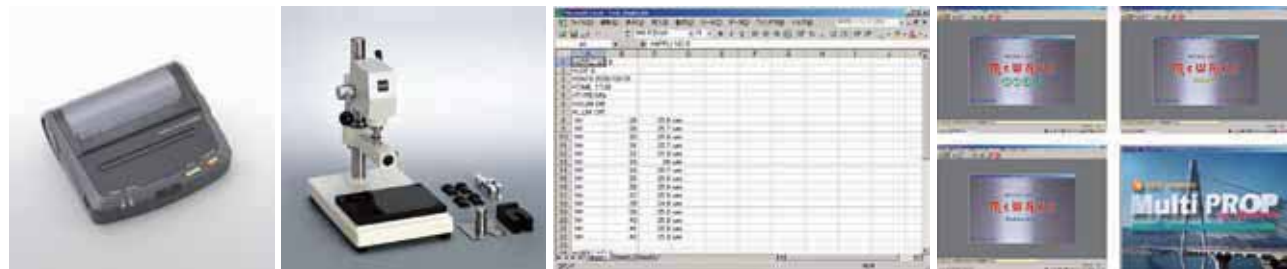
オプション

プリンタ VZ-380

測定スタンド LW-990

データ管理ソフトウェア「データロガーソフト LDL-03」

データ管理ソフトウェア「McWAVEシリーズ」

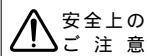


株式会社ケット科学研究所

東京本社 東京都大田区南馬込 1-8-1 〒143-8507
TEL(03)3776-1111 FAX(03)3772-3001
大阪支店 大阪市東淀川区東中島 4-4-10 〒533-0033
TEL(06)6323-4581 FAX(06)6323-4585
札幌営業所 札幌市西区八軒一条西 3-1-1 〒063-0841
TEL(011)611-9441 FAX(011)631-9866
仙台営業所 仙台市青葉区二日町 2-15 二日町鹿島ビル 〒980-0802
TEL(022)215-6806 FAX(022)215-6809
名古屋営業所 名古屋市中村区名駅 5-6-18 伊原ビル 〒450-0002
TEL(052)551-2629 FAX(052)561-5677
九州営業所 佐賀県鳥栖市布津原町 14-1 布津原ビル 〒841-0053
TEL(0942)84-9011 FAX(0942)84-9012



当社の製品は ISO 9001、品質マネジメントシステムに準拠して製作されています。
適用範囲:水分計、成分分析計、穀粒判別器及び膜厚計の設計、開発、製造管理、校正、修理。



安全上の注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。故障の原因となることがあります。

ご用命は



この印刷物は環境への配慮から「植物油インキ」と「再生紙」を使用しています。

この商品へのお問い合わせは上記、またはE-mailでお願いいたします。 URL <http://www.kett.co.jp/> E-mail sales@kett.co.jp 1206・KA・0101・005K

製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。

膜厚計 373 シリーズ

電磁膜厚計 LE-373 / 渦電流膜厚計 LH-373 / デュアルタイプ膜厚計 LZ-373



